

ИКТ тестовый зонд SF-PA100-J (L38.8)

Материал и отделка

Плунжер: бронза или латунь или BeCu, позолоченные или никелированные;

Ствол: латунь, позолота или никелирование;

Пружина: нержавеющая сталь или музыкальный провод;

Картинки

- Любые советы, которые мы могли бы предоставить для вас
- Если вы заинтересованы в этом, пожалуйста, свяжитесь со мной

SFENG
The China's The World's

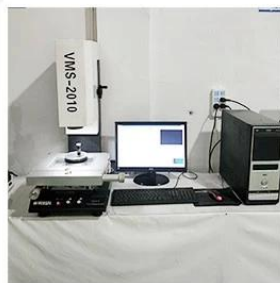


Spring loaded pin (single) for PCB, ICT, FCT testing etc;
Pogo pin (connector) to establish connection between two printed circuit boards for charging, locating, Battery, Semiconductor & Interconnect applications;
Double ended probe for BGA and Semiconductor testing;
Universal pin without spring, coating pin, LM pin with QZ and VZ series;
High current probe, Switch probe, Capacitance needle;
Terminal & receptacle /socket;
Other related electronic components, 30# OK wire, Jig locks, POM, Iron hinge etc

Контроль испытательного оборудования



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Упаковка и отгрузка

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

